PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-031616

(43) Date of publication of application: 02.02.1996

(51)Int.CI.

H01C 7/10 H01C 1/142

(21)Application number: 06-167952

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

20.07.1994

(72)Inventor:

MATSUYAMA YOSHIO

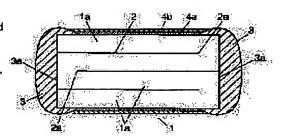
WAKAHATA YASUO TOKUNAGA HIDEAKI

(54) VARISTOR AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the plating-resistance and damp-proof property by a method wherein an electrode is formed on the surface of a varistor element, a mixture mainly composed of SiO2 is provided on the surface of the varistor element and fired, and a high resistance layer mainly composed of Zn-Si-O is formed on the part which is not covered by the electrode of the surface of the varistor element.

CONSTITUTION: A ceramic sheet 1a, which is mainly composed of ZnO, and an inner electrode 2 are laminated, Ag paste is coated on both edge faces of a fired varistor element 1, and an electrode is baked. Then, when the varistor 1 is embedded and fired in the mixture which is mainly composed of SiO2 the main component ZnO of the varistor element 1 and SiO2 are reacted with each other, and a high resistance layer 4a mainly composed of Zn2SiO4 is formed on the surface of the element 1. Also when Bi2O3, is added as a subcomponent to the varistor element 1, Bi2O3 is reacted with SiO2 and the high resistance layer 4a, mainly composed of Zn2O2, is formed on the surface of the varistor element 1 and a high resistance layer 4b, mainly composed of Bi4(SiO4)3, is formed thereon.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.10.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3453857

[Date of registration]

25.07.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-31616

(43)公開日 平成8年(1996)2月2日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01C 7/10 1/142

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特顯平6-167952	(71)出願人 000005821
(00) (I) FF F	W-2 a 2000 a 2000	松下電器産業株式会社
(22) 出顧日	平成6年(1994)7月20日	大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者 松山 美穂
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 若畑 康男
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
	,	産業株式会社内
		(72) 発明者 徳永 英晃
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
	•	(74)代理人 弁理士 小鍜治 明 (外2名)

(54) 【発明の名称】 パリスタとその製造方法

(57)【要約】

【目的】 バリスタ素子表面に、耐湿性、耐メッキ性に 優れた高抵抗層を有するバリスタを提供することを目的 とするものである。

【構成】 バリスタ素子1の表面に SiO_2 を主成分とする混合物15を配し、焼成することにより、バリスタ素子1の表面に、2n-Si-O系の物質からなる高抵抗層4aを形成するものである。

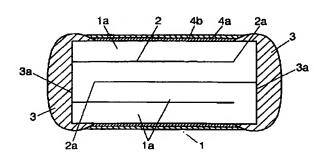
1 バリスタ素子

2 内部電極

2a 遊端

3 外部電極

3a, 4a, 4b 高抵抗層



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ZnOを主成分とするバリスタ素子と、前記バリスタ素子の表面に設けた電極と、前記バリスタ素子表面の少なくとも前記電極に覆われていない部分に設けた高抵抗層とを備え、前記高抵抗層はZnーSiーO系の物質を主成分とするバリスタ。

1

【請求項2】 バリスタ素子と、前記バリスタ素子の表面に設けた電極と、前記バリスタ素子表面の少なくとも前記電極に覆われていない部分に設けた第1の高抵抗層と、前記第1の高抵抗層の上に設けた第2の高抵抗層と 10を備え、前記バリスタ素子はZnOを主成分とし、副成分として少なくともBiを含有し、前記第1の高抵抗層はZn-Si-O系の物質を主成分とし、前記第2の高抵抗層はBi-Si-O系の物質を主成分とするバリスタ。

【請求項3】 バリスタ素子と、前記バリスタ素子の表面に設けた電極と、前記バリスタ素子表面の少なくとも前記電極に覆われていない部分に設けた第1の高抵抗層と、前記第1の高抵抗層の上に設けた第2の高抵抗層とを備え、前記バリスタ素子はZnOを主成分とし、副成20分として少なくともBを含有し、前記第1の高抵抗層はZn-Si-O系の物質を主成分とし、前記第2の高抵抗層はB-Si-O系の物質を主成分とするバリスタ。

【請求項4】 バリスタ素子と、前記バリスタ素子の表面に設けた電極と、前記バリスタ素子表面の少なくとも前記電極に覆われていない部分に設けた第1の高抵抗層と、前記第1の高抵抗層の上に設けた第2の高抵抗層とを備え、前記バリスタ素子はZnOを主成分とし、副成分として少なくともBi, Bを含有し、前記第1の高抵抗層はZn-Si-O系の物質を主成分とし、前記第2の高抵抗層はBi-Si-O系の物質と、B-Si-O系の物質とを主成分とするバリスタ。

【請求項5】 バリスタ素子と、前記バリスタ素子の内部に設けた内部電極と、前記バリスタ素子の両端面に、前記内部電極と電気的に接続するように設けた外部電極と、前記バリスタ素子表面の少なくとも前記電極で覆われていない部分に設けた高抵抗層とを備え、前記内部電極の遊端に対向する前記外部電極の前記バリスタ素子側面に高抵抗層を設けたバリスタ。

【請求項6】 ZnOを主成分とする原材料を成形して バリスタ素子を得、次に前記バリスタ素子表面に電極を 形成し、次に前記バリスタ素子の表面にSiOzを主成 分とする混合物を配して焼成し、前記バリスタ素子の表 面に高抵抗層を形成するバリスタの製造方法。

【請求項7】 ZnOを主成分とする原材料を成形して バリスタ素子を得、次に前記バリスタ素子の表面に第1 の電極を形成し、次に前記バリスタ素子の表面にSiO 2を主成分とする混合物を配して焼成し、前記バリスタ 素子表面に高抵抗層を形成後、前記第1の電極上に第2 の電極を形成するバリスタの製造方法。 【請求項8】 ZnOを主成分とする原材料を成形して バリスタ素子を得、次に前記バリスタ素子の表面にSiOzを主成分とする混合物を配して焼成して前記素子表 面に高抵抗層を形成し、次に前記バリスタ素子の表面に 電極を形成するバリスタの製造方法。

【請求項9】 ZnOを主成分とする原材料を成形して バリスタ素子を得、次に前記バリスタ素子を、ケイ素化 合物を含む液体に浸漬し、その後、前記バリスタ素子を 焼成して、前記バリスタ素子の表面に高抵抗層を形成す るバリスタの製造方法。

【請求項10】 ケイ素化合物として、(CH₃O), S i, (C₂H₅O), Si, (C₃H₇O), Si, (C₄H₃O), Siのうち少なくとも一種類以上を用いる請求項9記載 のバリスタの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はバリスタとその製造方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、チップ部品は半田付け時に半田により、Ag外部電極が、侵されてしまうため、Ag外部電極の上にNiメッキ等を施し、この上からさらに、半田付け性向上のため半田メッキを施している。しかし、ZnOバリスタは、半導体であるため電解メッキを行うと、セラミック素子表面もメッキされてしまうので、これを防ぐために、セラミック素子表面にSi,B,Bi,Pb,Ca等からなるガラスをディップして、高抵抗層を形成していた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、ガラスによる 高抵抗層は選択的にセラミック素子表面だけに形成する ことができず、また均一な厚さにすることが困難であっ た。このため、メッキをするときメッキ流れをおこして ショートしたり、水分等がセラミック素子内部に浸入し てバリスタ特性を劣化させたりするという問題点を有し ていた。

【0004】そこで本発明は、緻密で均一な厚みを有し、選択的にセラミック素子表面に高抵抗層を形成し、耐メッキ性、耐湿性に優れたバリスタを提供することを目的とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために、本発明はバリスタ素子の表面に電極を形成し、次にバリスタ素子の表面にSiO₂を主成分とする混合物を配し、その後焼成し、バリスタ素子表面の少なくとも電極に覆われていない部分に主成分が2n-Si-O系の物質である高抵抗層を形成するものである。

[0006]

【作用】この構成により、バリスタ素子表面のZnO成 50 分がSiO₂と反応し、バリスタ素子表面に主成分がZ n-Si-O系の物質である高抵抗層が形成される。しかし、バリスタ素子表面に設けられた電極とSiO₂は反応しないので選択的に電極形成部分を除く、バリスタ素子表面に、高抵抗層が形成され、前記電極上にメッキすることができる。また、この高抵抗層は、緻密で均一な厚みを有するので、メッキ流れや余分な水分などが浸入するのを防ぐことができるので、耐湿性、耐メッキ性に優れたバリスタを得ることができる。

【0007】さらに、積層型のバリスタの場合、外部電極とバリスタ素子の間にも、高抵抗層が形成されるので、内部電極の遊端と、対向する外部電極の距離を短くすることができる。すなわち、内部電極の面積を大きくすることができるので、サージ耐量の大きなバリスタを得ることができる。

【0008】なお外部電極のバリスタ素子側面に高抵抗層が形成される理由は、現時点で明確になっていないが、バリスタ素子の成分とSiO2とが反応して液相化し、界面から液相化した高抵抗成分が素子内に浸入するためであると思われる。

[0009]

【実施例】

(実施例1)図1において、1はバリスタ素子で、その内部にはAg製の内部電極2が複数設けられている。これらの内部電極2には、交互にバリスタ素子1の両端に引き出され、その両端において、外部電極3と電気的に接続されている。

【0010】また、内部電極2間、及びその外側に積層されたセラミックシート1aは、ZnOを主成分とし、副成分として Bi_2O_3 , Co_2O_3 , MnO_2 , Sb_2O_3 , B_2O_3 等を含んでいる。

【0011】図2は製造工程を示し、セラミックシート 1 a は図2において(5)で示すごとく原料の混合、粉 砕、スラリー化、シート成形により作製した。次にこの セラミックシート1 a と、内部電極2とを積層(6) し、それを切断(7)し、930℃で30分間焼成

(8)後、シェーカーで1時間、セラミック素子1の表面の面取(9)をした。

【0012】次に、セラミック素子1の両端面にAg電極ペーストを塗布(10)し、750 \mathbb{C} ~ 850 \mathbb{C} で Ag 電極焼付(11)し、その後、図3 に示すごとくSi O_2 を主成分とする混合物15 にバリスタ素子1 を埋没させ、空気中あるいは酸素雰囲気中で750 \mathbb{C} ~ 950 \mathbb{C} ~ 5 $\rightarrow 0$ ~ 10 時間、焼成した(図2 ~ 12)。

【0013】この焼成により、バリスタ素子1の主成分2nOと、SiO2が反応して、主に2n2SiO4からなる高抵抗層4aが前記バリスタ素子1表面上に形成される。また、バリスタ素子1に副成分として、Bi2O3を添加した場合、Bi2O3がSiO2と反応して、主に2n2SiO4からなる高抵抗層4a2、この高抵抗層4a0上に、主にBi4SiO4)3からなる高抵抗層4b

とがバリスタ素子1の表面上に形成される。

【0014】また、バリスタ素子1の副成分として B_2 O_3 を添加した場合、 B_2O_3 が S_iO_2 と反応して、主に $Z_{n_2}S_iO_4$ からなる高抵抗層4aと、この上に、主に B_2 (S_iO_4) $_3$ からなる高抵抗層4bとがバリスタ素子 1の表面上に形成される。

【0015】さらに、バリスタ素子1に、副成分とし て、Bi₂O₃とB₂O₃とを添加した場合、Bi₂O₃とB 2O3とがSiO2と反応して、主にZn2SiO4からな 10 る高抵抗層 4 a と、この上に、主にB i (S i O₁) a と B2 (SiO1)2 とからなる高抵抗層4bとがバリスタ素 子1の表面上に形成される。これら反応により生じた物 質は、バリスタの特性への悪影響は生じず、バリスタと して極めて特性の優れたものが得られる。ここで重要な ことは、図3に示すごとく個々のバリスタ素子1を全て SiOzを主成分とする混合物15に埋没させておくこ とである。そのために、まずアルミナのるつぼ16の中 に所定の厚さでSiO2を主成分とする混合物15を敷 きつめ、その上に、バリスタ素子1を隣接するものと接 20 触しないように並べ、その状態でSiO2を主成分とす る混合物15を充分に覆いかぶせた。この状態で焼成を 行った後に、バリスタ素子1表面と、外部電極3表面の SiO2を主成分とする混合物15を取り除いた。この 除去は例えば容器内にSiCの玉石と純水とバリスタ素 子1とを入れて撹拌したり、エアーガンで複数のバリス タ素子1を容器内で揺動させたりして行った。その後、 外部電極3表面に2A, 30minで電解Niメッキ、そ の上に0. 6A, 30minで半田メッキ(図2の14) を行い、バリスタを得た。

[0016]得られたバリスタの断面から、メッキの厚みは、Niメッキが 1.2μ m、半田メッキは 1.3μ mであった。

【0017】また、耐メッキ性を調べ(表1) に示した。

[0018]

【表1】

T]		
	メッキ液による パリスタ素子の腐食	メッキ流れ
従 来 例コート無し	腐食される	100%
従 来 例コート有り	局部的に腐食される	7~8%
本発明	腐食されない	0%

(注)メッキ流れとは素子表面上にメッキがされること

【0019】(表1)に示すように、高抵抗層4a,4bを有していないバリスタ素子1にメッキを行うと、外部電極3の形成部分以外のバリスタ素子1の表面積の100%がメッキされてしまう。

【0020】また、従来のように、バリスタ素子1の表

面にガラスによる高抵抗層を形成したものは、7~8% メッキされた。しかし、本実施例によるものは、バリス タ素子1の外部電極3形成部分以外は全くメッキされな かった。

5

【0021】また、本発明のバリスタは、メッキ時も、 メッキ液による、バリスタ素子1の腐食が起きないの で、優れた特性を有するものである。

【0022】 (実施例2) 実施例1 と同様にして、外部電極3 塗布 (10) 後のバリスタ素子1 を、図3 に示すごとく、S i O_2 を主成分とする混合物15 に、埋没させ、この状態で、750~950 で5 分 ~ 10 時間焼成した。その後、外部電極3 上に、さらにA g電極ペーストを塗布し、750~850 で10~60 分間A g電極焼付を行い、次にメッキ(14)を行ってバリスタを得た。

【0023】また、実施例2において SiO_2 を主成分とする混合物15にバリスタ素子1を埋没させて反応させた後、外部電極3上についた SiO_2 の反応物は実施例1と同様に除去してから、さらに外部電極3の上にAgを塗布して焼付てもよい。

【0024】実施例1と同様に、実施例2においても、バリスタ素子1の主成分Z n O と、S i O₂が反応して、主にZ n₂ S i O₄からなる高抵抗層4 a が前記バリスタ素子1表面上に形成される。また、バリスタ素子1に副成分として、B i $_2$ O₃が添加した場合、B i $_2$ O₃が S i O₂ と反応して、主にZ n₂ S i O₄からなる高抵抗層4 a と、この高抵抗層4 a の上に、主にB i $_4$ (S i O₄) $_3$ からなる高抵抗層4 b とがバリスタ素子1の表面上に形成される。

【0025】また、バリスタ素子1の副成分として B_2 O_3 を添加した場合、 B_2O_3 が SiO_2 と反応して、主に Zn_2SiO_4 からなる高抵抗層4aと、この上に、主に $B_2(SiO_4)_3$ からなる高抵抗層4bとがバリスタ素子 1の表面上に形成される。

【0026】さらに、バリスタ素子1に、副成分として、Bi₂O₃とB₂O₃とを添加した場合、Bi₂O₃とB
₂O₃とがSiO₂と反応して、主にZn₂SiO₄からなる高抵抗層4aと、この上に、主にBi₄(SiO₄)₃とB₂(SiO₄)₃とからなる高抵抗層4bとがバリスタ素子1の表面上に形成される。これら反応により生じた物 40 質は、バリスタの特性への悪影響は生じず、バリスタとして、極めて優れた特性を有するものが得られる。

【0027】(実施例3) 実施例1と同様にして、面取(9)後、図3に示すごとく、SiO₂を主成分とする混合物15にバリスタ素子1を埋没させ、この状態で750℃~950℃で5分~10時間、加熱する。加熱後、外部電極3を塗布(10)し、750℃~850℃、10~60分でAg電極焼付、メッキ(14)を行う。

【0028】実施例1と同様に、実施例3においても、

バリスタ素子1の主成分ZnOと、SiO2が反応して、主にZn2SiO4からなる高抵抗層4aが前記バリスタ素子1表面上に形成される。また、バリスタ素子1に副成分として、Bi2O3を添加した場合、Bi2O3が SiO2と反応して、主にZn2SiO4からなる高抵抗層4a2、この高抵抗層4a0上に、主にBi4SiO4)3からなる高抵抗層45 とがバリスタ素子1の表面上に形成される。

【0029】また、バリスタ素子1の副成分として B_2 O $_3$ を添加した場合、 B_2 O $_3$ が S_i O $_2$ と反応して、主に Z_{n_2} S $_i$ O $_4$ からなる高抵抗層4aと、この上に、主に B_2 (S_i O $_4$) $_3$ からなる高抵抗層4bとがバリスタ素子1の表面上に形成される。

【0030】さらに、バリスタ素子1に、副成分として、Bi₂O₃とB₂O₃とを添加した場合、Bi₂O₃とB
₂O₃とがSiO₂と反応して、主にZn₂SiO₄からなる高抵抗層4aと、この上に、主にBi₄(SiO₄)₃とB₂(SiO₄)₃とからなる高抵抗層4bとがバリスタ素子1の表面上に形成される。これら反応により生じた物質は、バリスタの特性への悪影響は生じず、バリスタとして、極めて優れた特性を有するものが得られる。

【0031】(実施例4)実施例1と同様にして、セラミック素子1を得た後、(CH₃O)₄Si, (C₂H₅O)₄Si, (C₃H₇O)₄Si, (C₄H₅O)₄Si, (C₄H₅O)₄Si, (C₄H₅O)₄Si のうち少なくとも1種類以上含む液体に、セラミック素子1を浸漬させ、その後、空気中あるいは酸素雰囲気中で、700~850℃で30分間焼成して高抵抗層4a,4bを形成した。このようにバリスタ素子1を上記液体に浸漬することにより、この液体が、バリスタ素子1の表面に入り30込み、接触面積が広くなり、反応性が良くなると共に均一な厚さの膜が得られる。

【0032】本実施例においても、実施例1と同様にバリスタ素子1の主成分2nOと、SiO2が反応して、主に2n2SiO4からなる高抵抗層4aが前記バリスタ素子1表面上に形成される。また、バリスタ素子1に副成分として、Bi2O3を添加した場合、Bi2O3がSiO3と反応して、主に2n3SiO4からなる高抵抗層4aと、この高抵抗層4aの上に、主にBi4(SiO4)3からなる高抵抗層4bとがバリスタ素子1の表面上に形成される。

【0033】また、バリスタ素子1の副成分として B_2 O $_3$ を添加した場合、 B_2 O $_3$ がS i O $_2$ と反応して、主に Z n_2 S i O $_4$ からなる高抵抗層4 a と、この上に、主に B_2 (S i O $_4$) $_3$ からなる高抵抗層4 b とがバリスタ素子 1 の表面上に形成される。

【0034】さらに、バリスタ素子1に、副成分として、Bi₂O₃とB₂O₃とを添加した場合、Bi₂O₃とB₂O₃とがSiO₂と反応して、主にZn₂SiO₄からなる高抵抗層4aと、この上に、主にBi₄(SiO₄)₃と 50 B₂(SiO₄)₃とからなる高抵抗層4bとがバリスタ素 20

子1の表面上に形成される。これら反応により生じた物 質は、バリスタの特性への悪影響は生じず、バリスタと して、極めて優れた特性を有するものが得られる。

【0035】なお実施例1~4においてSiO₂を主成 分とする混合物15にバリスタ素子1を埋没させる場 合、図4のように埋め込むだけでも高抵抗層は形成され るが、反応性を考えた場合、図3のようにアルミナのる つぼ16中で反応させ、さらにおもしなどをして、圧力 をかけてSiO₂を主成分とする混合物15とバリスタ 素子1との密着性を上げた方がよい。また、ニッケル製 10 あるいは磁器製等のバリスタ素子1と反応しない材料で できた容器内にニッケルあるいはジルコニア等のバリス タ素子1と反応しない玉石と、バリスタ素子1とSiO 2を主成分とする混合物15とを入れ、回転させながら 撹拌して反応を行うと、より均一に反応させることがで きると思われる。

【0036】また、液体に浸漬したバリスタ素子を実施 例1~3と同様に、混合物15に埋没させて、高抵抗層 4 a, 4 bを形成するとさらに均一な厚さを有する緻密 なものが形成できる。

【0037】さらに、玉石は、バリスタ素子1よりも小 さいものを用いることが好ましい。また混合物15はS iO₂を主成分とする粉体であるが、バリスタ素子1と の反応性を良くするために、粒径を2μm以下にするこ とが望ましい。そして、SiO2以外に混合物15に用 いる粉体として、マンガン、鉄、ニッケル、アンチモ ン、アルミニウム、ジルコニア等の酸化物が望ましい。

【0038】この混合比や加熱温度、その時間を調整す ることにより膜厚を制御できる。また、高抵抗層を形成 する際、1200℃以下にすることが望ましい。という のは1200℃を越えるとSiがガラス化してしまい、 バリスタ素子1同士がひっついてしまうからである。

【0039】そして昇温を一気に行うことにより、バリ スタ素子1の成分が蒸発して、ポアになるのを防ぐこと ができる。これに対して降温は、特に500~800℃ の間は、50℃/hで降温させることが望ましい。これ により、バリスタ素子1の内部に酸素が十分に供給さ れ、低電流領域でのバリスタ特性が向上する。

【0040】また、本発明のバリスタと従来のバリスタ の湿中負荷試験を行い、その結果を図5に示した。

【0041】図5を見るとわかるように、従来のバリス タは100時間を過ぎると

[0042]

【外1】

パリスタ電圧 (V 10μA)

【0043】が大きく変化するが、本発明のバリスタ は、ほとんど変化していない。このように、本発明のバ リスタは従来のものと比較すると非常に耐湿性に優れて いることがわかる。

要な無効層厚みを示している。

[0045]

【表2】

	無効層厚み 有効層厚み	サージ耐量
従来品	2	500(A)
(化米的	1	200(A)
	1	1000(A)
本発明品	0.5	1000(A)
	0.2	1000(A)

【0046】(表2)によると、従来のバリスタは、も れ電流を防ぐため、サージ耐量が500Aのバリスタで は、無効層の厚みを有効層一層の厚みの2倍に、また2 00Aのバリスタでは、無効層の厚みを有効層一層の厚 みと同じに最低限しなければならなかった。しかし、本 発明のバリスタは、サージ耐量が1000Aのバリスタ でも、無効層の厚みを有効層一層の厚みの0. 2倍にし ても、外部電極3とバリスタ素子1の間に高抵抗層4 a, 4bが介在しているので、もれ電流を防ぐことがで きる。

【0047】さらに、図1に示した積層型のバリスタの 場合、外部電極3とバリスタ素子1の間にも、高抵抗層 3 a が形成されるので、内部電極2の遊端2 a と、対向 する外部電極3の距離を短くすることができる。すなわ ち、内部電極2の面積を大きくすることができるので、 サージ耐量の大きなバリスタを得ることができる。

【0048】なお外部電極3の内面側にも高抵抗層3a が形成される理由は現時点で十分判明していないが、バ リスタ素子の成分とSiO2とが、反応して液相化し、 界面から液相化した高抵抗成分が素子内に浸入するため であると思われる。

[0049]

【発明の効果】以上のように、本発明はバリスタ素子表 面の電極に覆れていない部分に、主成分がZn2SiO4 の高抵抗層、あるいは下層がZn2SiOcを主成分とす る高抵抗層、上層がB i 4 (S i O 4)3 を主成分とする高 抵抗層、あるいは下層がZnzSiOtを主成分とする高 抵抗層、上層がB2(SiO4)3を主成分とする高抵抗 40 層、あるいは、下層が Z n₂ S i O₄ を主成分とする高抵 抗層、上層が主にBi、(SiO1)3とB2(SiO1)3から なる高抵抗層を形成するものである。

【0050】これらの高抵抗層は、緻密で均一な厚さを 有するので不要な水分などがバリスタ素子内に浸入し て、バリスタ特性を劣化させることがない。また、メッ キ時も、メッキ流れを起こしショート不良が発生するの を防ぐことができる。さらに、無効層の厚みを従来より も薄くすることができるので、小型化を図ることができ る。このように、本発明の高抵抗層は耐薬品性、耐湿性 【0044】また、 (表2) に、サージ耐量に対する必 50 に優れているので、優れた特性を有するバリスタを得る

10

ことができる。

【0051】さらに、積層型のバリスタの場合、外部電極とバリスタ素子の間にも、高抵抗層が形成されるので、内部電極の遊端と、対向する外部電極の距離を短くすることができる。すなわち、内部電極の面積を大きくすることができるので、サージ耐量の大きなバリスタを得ることができる。

9

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例におけるバリスタの断面図

【図2】本発明の一実施例におけるバリスタの製造工程 10

【図3】本発明の一実施例における焼成工程の説明図 *

*【図4】本発明の一実施例における焼成工程の説明図 【図5】本発明の一実施例におけるバリスタの耐湿性を 表す特性曲線図

【符号の説明】

- 1 バリスタ素子
- 2 内部電極
- 2 a 遊端
- 3 外部電極
- 3 a 高抵抗層
- 4 a 高抵抗層
- 4 b 高抵抗層

【図1】

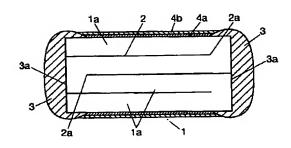
1 バリスタ楽子

2 内部電極

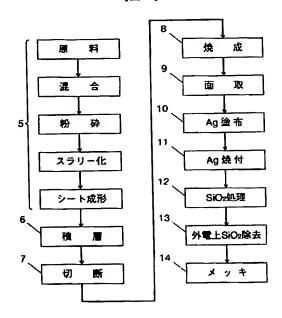
2a 遊鑑

3 外部電極

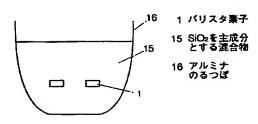
3a, 4a, 4b 高抵抗層



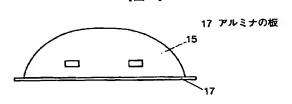
【図2】

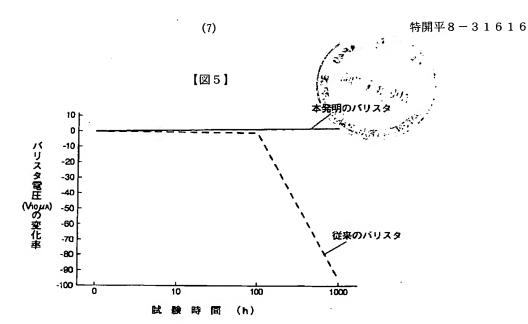


【図3】



【図4】







THIS PAGE BLANK (USPTO)